

可根据客户需求定制校正曲线

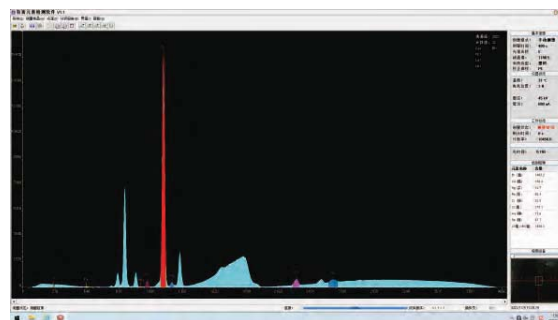


视频

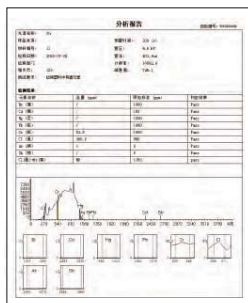
X射线荧光光谱仪 (RoHS检测仪/合金成分分析仪/镀层测厚仪) 型号 XRF-B210C



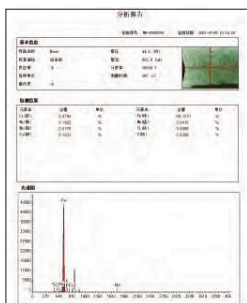
- 可用于RoHS检测、合金元素分析、电镀层测厚等
- 采用Si-PIN探测器, 电制冷, 体积小, 数据分析准确且维护成本低
- 七种光路校正准直系统, 根据不同样品自动切换
- 多重防辐射泄露设计
- 机芯温度监控技术, 保证X射线源安全可靠运行, 有效延长使用寿命, 降低使用成本
- 专用测试软件, 标准视窗设计, 界面友好, 操作方便
- 可同时显示多个光谱图, 打印多种报告形式
- USB3.0 接口, 保证数据准确高速有效的传输



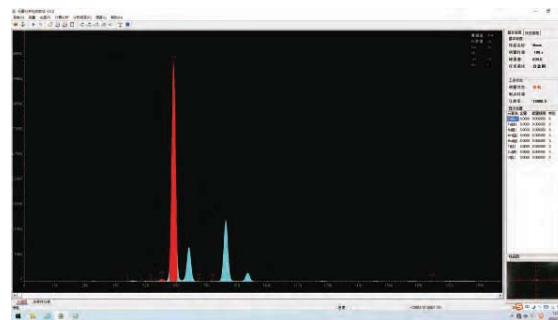
RoHS检测软件(标配)



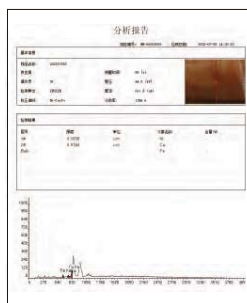
RoHS检测报告(标配)



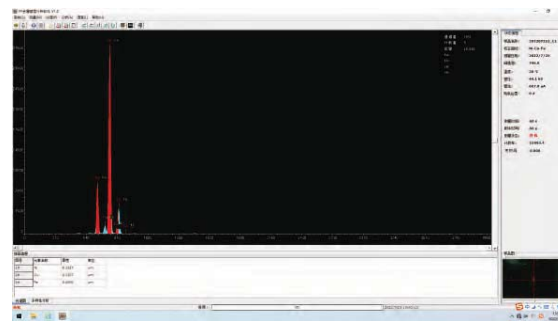
合金成分分析报告(标配)



合金成分分析软件(标配)



镀层厚度检测报告(标配)



镀层厚度检测软件(标配)

技术参数

探测器	类型	Si-PIN电制冷半导体探测器	
	分辨率	149±5电子伏特	
	放大电路模块	对样品特征X射线进行探测,把探测采集的信息进一步放大	
X射线激发装置	最大输出电流	1mA	
	功率	50W,空冷	
高低压电源	最大输出电压	50KV,自带电压过载保护	
	最小输出电压	5KV	
多道脉冲幅度分析器		最大道数: 4096	
光路过滤模块		降低X射线光路发送过程中的干扰,保证探测器接收信号准确 将准直器与滤光片整合	
准直器自动切换模块		7种, Ø0.5~Ø8mm	
滤光片自动切换模块		5种(可自由选择和切换)	
RoHS分析软件	元素分析范围	硫(S)~铀(U)	
	有害元素分析	Cd, Pb, Hg, Br, Cr, Cl, As, Sb	
	测量时间	60~200s	
	检出限	2PPM	
	含量分析范围	2PPM~99.99%	
合金分析软件	元素分析范围	钛(Ti)~铀(U)	
	检出限	100PPM	
	含量分析范围	100PPM~99.9%	
	重复性	0.1%	
	稳定性	0.1%	
金属镀层分析软件	元素分析范围	钛(Ti)~铀(U)	
	检出限	0.01µm	
	分析厚度	单层厚度	0.01~30µm
		3层厚度	≤10µm
	重复性	0.1µm(小于1µm的最外层镀层)	
	稳定性	0.1µm(小于1µm的最外层镀层)	
测试光斑	0.2mm以内		
温度		10~30°C	
湿度		10%~90%	
电源		AC 220V±5V	
尺寸		700×460×370mm	
重量		49kg	

标准配件

主机	1个
标准样品	1个
银校准片	1个
样品杯	2个
测试薄膜	50片
电脑	1台
彩色喷墨打印机	1台
准直器(内置)	7个
软件	RoHS测试软件,合金成分分析软件,镀层厚度检测软件